

УДК 538.913

©1995

**РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗМУЩЕНИЯ  
В ПРИБЛИЖЕНИИ ЖЕСТКОГО СДВИГА  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ**

*Б.В.Новыш, Н.Н.Дорожкин, Е.М.Гололобов, В.М.Анищик*

Институт физики твердого тела и полупроводников  
Академии наук Белоруссии, 220726, Минск, Белоруссия  
(Поступила в Редакцию 15 июня 1994 г.)

Представлен метод расчета потенциала возмущения в приближении жесткого сдвига электронных плотностей МТ- или атомных сфер. В отличие от метода жесткого МТ-потенциала данных метод позволяет учесть дальнодействующие кулоновские взаимодействия (потенциал Маделунга), а также анизотропию и неоднородность кристаллического потенциала.

Как хорошо известно, приближение жесткого МТ-потенциала (Rigid Muffin-Tin Approximation (RMTA)) [1], традиционно используемое при расчетах параметра электрон-фононного взаимодействия и температуры перехода в сверхпроводящее состояние для классических сверхпроводников, оказалось непригодным применительно к высокотемпературным сверхпроводящим системам (ВТСП). В этой связи необходимо отметить, что характерное для этого метода представление потенциала возмущения через градиент обычного потенциала МТ-вида, используемого в зонных расчетах, исключает из рассмотрения внешнюю по отношению к МТ-сферам область (так как в этой области МТ-потенциал постоянен); потенциал внутрисферной области при этом аппроксимируется, как правило, лишь сферически-симметричной компонентой. Естественно, что корректность подобного рода расчетов применительно к соединениям со столь малой плотностью упаковки и низкой симметрией узлов решетки, как Y-, Bi- или Tl-содержащие ВТСП, вызывает сомнения.

В настоящей работе приводится схема расчета потенциала возмущения  $\delta V(\mathbf{r})$ , позволяющая в первом приближении учесть эффекты анизотропии и неоднородности кристаллического потенциала, и в частности влияние дальнодействующих кулоновских взаимодействий (потенциал Маделунга), что особенно важно для ВТСП-соединений, содержащих компоненты с большими эффективными зарядами. Предлагаемый метод основан на рассмотрении вызываемого фононами жесткого сдвига электронной плотности МТ- или атомных сфер (AC).

Периодичность решетки позволяет представить кристаллический потенциал в виде ряда Фурье по векторам обратной решетки  $\mathbf{G}$

$$V(\mathbf{r}) = V_{\text{en}}(\mathbf{r}) + V_{\text{H}}(\mathbf{r}) + V_{\text{ex}}(\mathbf{r})(1/\Omega) \sum_{\mathbf{G}} V(\mathbf{G}) \exp(i\mathbf{Gr}) = \\ = (1/\Omega) \sum_{\mathbf{G}} [V_{\text{en}}(\mathbf{G}) + V_{\text{H}}(\mathbf{G}) + V_{\text{ex}}(\mathbf{G})] \exp(i\mathbf{Gr}), \quad (1)$$

где  $V(\mathbf{G})$  — фурье-компоненты потенциала, включающего в себя взаимодействие электрона с ядрами ( $V_{\text{en}}(\mathbf{r})$ ), кулоновское электрон-электронное взаимодействие  $V_{\text{H}}(\mathbf{r})$  (потенциал Хартри) и обменный потенциал ( $V_{\text{ex}}$ ),  $\Omega$  — объем элементарной ячейки.

Аппроксимируя эффективный локальный потенциал суммой потенциалов МТ-сфер или АС и используя уравнение Пуассона, легко показать, что фурье-компоненты могут быть записаны в виде (атомная система единиц)

$$V(\mathbf{G}) = -(8\pi/G^2) \sum_j Z_j \exp(-i\mathbf{GR}_j) + (8\pi/G^2) \sum_j f_j(\mathbf{G}) \exp(-i\mathbf{GR}_j) + \\ + \sum_j \phi_j^{\text{ex}}(\mathbf{G}) \exp(-i\mathbf{GR}_j) = \sum_j W_j(\mathbf{G}) \exp(-i\mathbf{GR}_j), \quad (2)$$

где суммирование ведется по атомам элементарной ячейки,  $Z_j$  и  $f_j$  — заряды ядер и рассеивающие факторы, а  $\phi_j^{\text{ex}}$  — обменная составляющая формфакторов МТ-сфер или АС (в дальнейшем используется приближение Конна-Шэма для обменно-корреляционного взаимодействия).

В настоящей работе мы используем приближение АС линейного метода МТ-орбиталей (ЛМТО) [2,3]. Полученные выражения легко могут быть модифицированы для МТ-сфер. В приближении АС и учете лишь сферически-симметричной компоненты электронной плотности внутри сферы имеем

$$f_j(\mathbf{G}) = 4\pi \int_0^{R_j^{\text{AS}}} \rho_j(r') r'^2 j_0(Gr') dr', \quad (3)$$

$$\phi_j^{\text{ex}}(\mathbf{G}) = -2(3/\pi)^{1/3} 4\pi \int_0^{R_j^{\text{AS}}} \rho_j^{1/3}(r') r'^2 j_0(Gr') dr', \quad (4)$$

где  $j_0$  — сферическая функция Бесселя,  $R_j^{\text{AS}}$  — радиус АС иона  $j$ ,  $r' = |\bar{r} - \bar{R}_j|$ . Эффекты анизотропии внутрисферного заряда легко могут быть учтены при расчете потенциала Хартри. При этом вместо (3) в формулах (1), (2) следует использовать выражение

$$f_j(\mathbf{G}) = 4\pi \sum_{L,M} (i)^L Y_{LM}(\hat{G}) \int_0^{R_j^{\text{AS}}} \rho_{LM}^j(r') r'^2 j_L(Gr') dr', \quad (5)$$

где  $\rho_{LM}^j(r')$  — угловые компоненты распределения электронной плотности внутри  $j$ -й сферы,  $Y_{LM}(\hat{G})$  — сферические гармоники, суммирование ведется по квантовым числам  $L, M$ .

Приведенные соотношения позволяют рассчитать эффективный однозарядный потенциал, создаваемый распределением заряда, полученным в методе ЛМТО. Потенциал возмущения  $\delta V(\mathbf{r})$ , связанный с наличием фона, может быть представлен в виде разности потенциалов возмущенной (со статическим искажением, соответствующим вмешанному в решетку фону) и исходной конфигураций кристаллической решетки.

Статическое искажение, вызванное фононами, нарушает (при  $\mathbf{q} \neq 0$ ) исходную трансляционную симметрию кристалла, так что представление  $V(\mathbf{r})$  в виде ряда Фурье по векторам  $\mathbf{G}$  должно быть заменено на аналогичное разложение по векторам обратной решетки искаженного кристалла, которые мы обозначим через  $\mathbf{Q}$  (естественно, объем элементарной ячейки должен быть при этом заменен на объем соответствующей суперячейки  $\Omega_{sc}$ ). Предполагая жесткое смещение внутрисферных электронных плотностей, потенциал возмущения можно аппроксимировать следующим выражением:

$$\delta V(\mathbf{r}) = V_2(\mathbf{r}) - V_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega_{sc}} \sum_Q [V_2(\mathbf{Q}) - V_1(\mathbf{Q})] \exp(i\mathbf{Q}\mathbf{r}) =$$

$$= \frac{1}{\Omega_{sc}} \sum_Q \exp(i\mathbf{Q}\mathbf{r}) \sum_k W_k(\mathbf{Q}) [\exp(-i\mathbf{Q}(\mathbf{R}_k + \delta\mathbf{R}_k)) - \exp(-i\mathbf{Q}\mathbf{R}_k)], \quad (6)$$

где суммирование по  $k$  проводится по атомам суперячейки, а поле смещений ионов определяется следующим образом:

$$\delta\mathbf{R}_k = \frac{1}{2} \left( \frac{\hbar}{2M_k\omega_\nu(\mathbf{q})} \right)^{1/2} [\epsilon_{\mathbf{q}\nu}(k) \exp(i\mathbf{q}\mathbf{R}_k) + c.c.], \quad (7)$$

где  $\epsilon_{\mathbf{q}\nu}(k)$  — вектор поляризации фона, соответствующий  $k$ -му иону с массой  $M_k$ ,  $\omega_\nu(\mathbf{q})$  — частота фона.

Отличие предлагаемой методики расчета  $\delta V(\mathbf{r})$  от применяемой в приближении жесткого МТ-потенциала состоит в том, что мы используем жесткий сдвиг МТ- или АС-плотностей вместо жесткого сдвига соответствующих внутрисферных потенциалов. Жесткий сдвиг внутрисферной электронной плотности приводит к анизотропии результирующего внутрисферного потенциала возмущения. Действительно, используя разложение  $\delta V(\mathbf{r})$  внутри сферы по сферическим гармоникам

$$\delta V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_k) = \sum_{L,M} \delta V_{LM}(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_k|) Y_{LM}(r \wedge R_k), \quad (8)$$

легко получить выражение для угловых компонент потенциала возмущения. Приравнивая правые части (8) и (6), умножая обе стороны

полученного соотношения на  $Y_{LM}^*(r - R_k)$  и интегрируя по угловым переменным, получим с учетом ортонормированности сферических гармоник

$$\delta V_{LM}(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_k|) = 4\pi i^L \sum_{\mathbf{Q}} \delta V(\mathbf{Q}) \exp(i\mathbf{Q}\mathbf{R}_k) J_L(|\mathbf{Q}| |\mathbf{r} - \mathbf{R}_k|) Y_{LM}^*(\hat{\mathbf{Q}}), \quad (9)$$

где мы использовали разложение плоской волны  $\exp(i\mathbf{Q}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_k))$  по сферическим гармоникам,  $\delta V(\mathbf{Q}) = V_2(\mathbf{Q}) - V_1(\mathbf{Q})$ . Учет несферических компонент потенциала возмущения в выражении для матричных элементов электрон-фононного взаимодействия приводит к возникновению новых каналов рассеяния электронов в дополнение к разрешенным в приближении жесткого МТ-потенциала ( $\Delta l = \pm 1$ ).

Построение  $\delta V(\mathbf{r})$  по описанной методике позволяет также учесть в случае использования МТ-сфер вклад в матричные элементы электрон-фононного взаимодействия потенциала межсферной области, что важно для систем с малой плотностью упаковки, в частности для ВТСП.

В связи с тем что потенциал возмущения обладает трансляционной симметрией решетки с вмороженным фононом, при расчете матричных элементов электрон-фононного взаимодействия интегрирование должно проводиться по объему соответствующей суперячейки

$$\langle \mathbf{k}' | \delta V(\mathbf{r}) | \mathbf{k} \rangle = \int_{\Omega_{sc}} \psi_{\mathbf{k}'}^*(\mathbf{r}) \delta V(\mathbf{r}) \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d^3 r. \quad (10)$$

В целях иллюстрации мы провели расчет потенциала возмущения для вмороженного в решетку ВТСП-соединения  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  оптического фонона  $A_g$ -симметрии ( $\mathbf{q} = 0, \omega = 110 \text{ cm}^{-1}$ ).

Рассеивающие факторы  $f_j(\mathbf{G})$  компонент соединения  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  рассчитывались с использованием самосогласованных радикальных электронных плотностей  $\rho_j(\mathbf{r})$ , полученных в ходе расчетов энергетической зонной структуры методом ЛМТО [4]. Расчет потенциала электрон-ядерного взаимодействия  $V_{en}$  проводился по методу Эвальда [5]. При расчете потенциала Хартри и обменного потенциала учитывалось около 70 000 векторов обратной решетки.

На рис. 1–3 приводятся расчетные распределения полного потенциала в плоскостях Cu1–O1, Cu2–O2–O3 и Ba–O4.

Распределение потенциала в плоскости Cu1–O1 (рис. 1) хорошо согласуется с известной анизотропией транспортных свойств электронов в этой плоскости; структура изолиний  $V(\mathbf{r})$  свидетельствует о том, что проводимость в данной плоскости осуществляется преимущественно вдоль цепочек Cu1–O1. «Мостиковая» структура  $V(\mathbf{r})$  может способствовать формированию медь-кислородных ковалентных связей (расчеты энергетической зонной структуры обнаруживают связи  $pd\sigma$ -типа в цепочках Cu1–O1). В отличие от плоскости Cu1–O1 в плоскости Cu2–O2–O3 не наблюдается существенного различия в распределении потенциала вдоль осей  $a$  и  $b$ ; небольшие различия в локальной структуре  $V(\mathbf{r})$  вблизи O2 и O3 связаны в основном с несколько различными

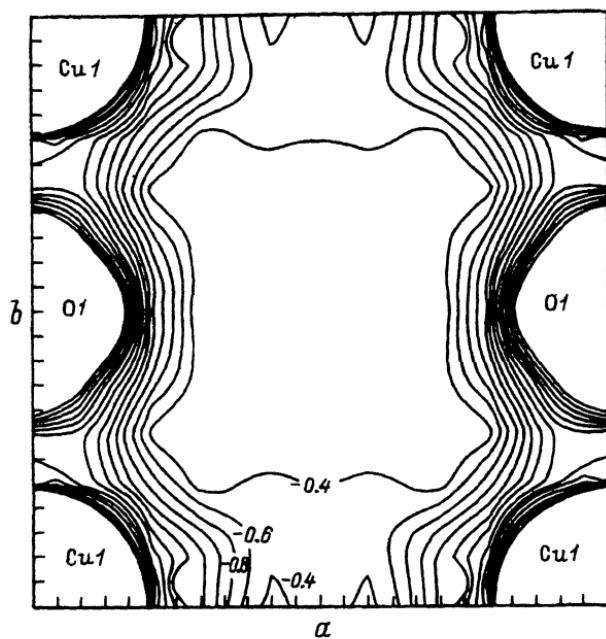


Рис. 1. Расчетное распределение потенциала в плоскости, содержащей узлы Cu1, O1.

Энергетический интервал между изолиниями потенциала составляет 0.2 Ry. Приведены изолинии с энергией выше -3 Ry.

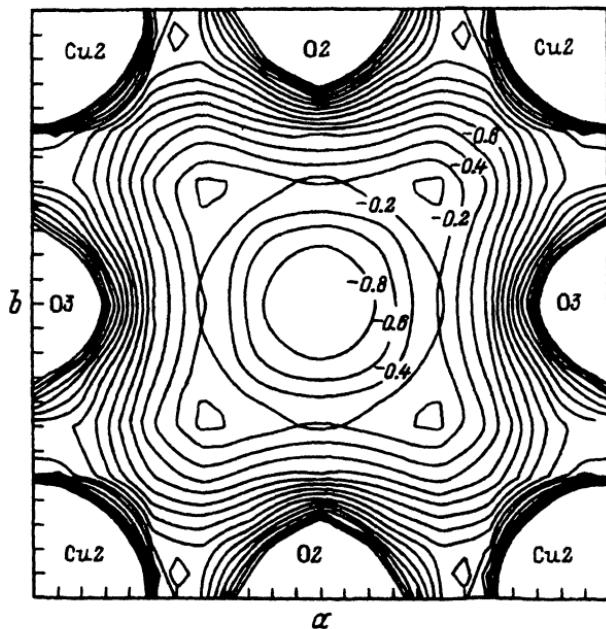


Рис. 2. Распределение потенциала в плоскости, проходящей через узлы Cu2. Энергетический интервал и энергия обрезания идентичны использованным на рис. 1. Узлы O2 и O3 смещены относительно данной плоскости на 0.478 и 0.513 а.е. соответственно.

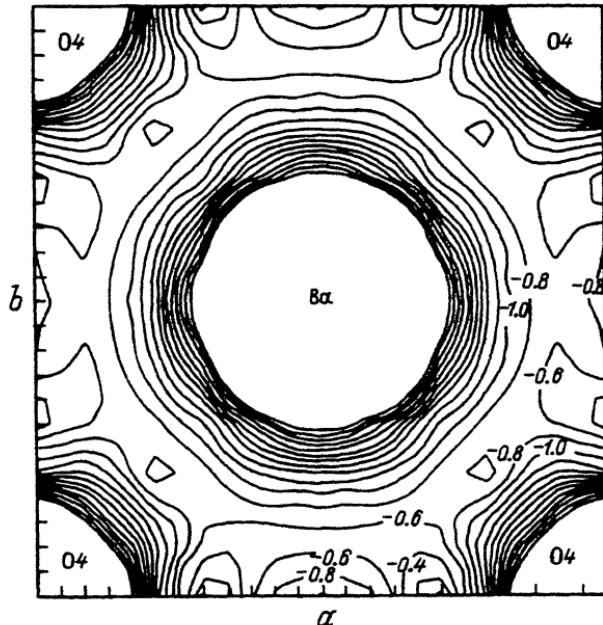


Рис. 3. Распределение потенциала в плоскости, проходящей через узлы O4.  $\Delta E = 0.2 \text{ Ry}$ ,  $E_{\min} = -3 \text{ Ry}$ . Ион бария смещен относительно данной плоскости на 0.57 а.е.

смещениями этих атомов вдоль оси с относительно плоскости, проходящей через узлы Cu2 (0.478 и 0.513 а.е. для O2 и O3 соответственно). Практически идентичная структура изолиний  $V(\mathbf{r})$  в окрестностях узлов O2 и O3 свидетельствует о незначительном влиянии орторомбического искажения элементарной ячейки (связанном с наличием цепочек Cu1-O1) на внутриионные потенциалы. Расчетное распределение потенциала в плоскости, проходящей через узлы O4 (рис. 3) характеризуется отсутствием «мостиковой» структуры, деформация изолиний  $V(\mathbf{r})$  вдоль диагоналей имеет главным образом электростатический (мадленговский) характер.

Результаты расчета потенциала возмущения для оптического фона  $A_g$ -симметрии ( $\mathbf{q} = 0$ ,  $\omega = 110 \text{ cm}^{-1}$ ) приводятся на рис. 4–6. Они соответствуют сдвигу иона Ba в направлении к плоскости Cu1-O1. Обращает на себя внимание сложная структура  $\delta V(\mathbf{r})$ , особенно в плоскости Cu1-O1. Следует отметить, что результаты наших расчетов заметно отличаются от получаемых в методе RMTA. Поскольку в рассматриваемой нами моде колебаний ионы Cu1, O1 не участвуют ( $\delta \mathbf{R}(\text{Cu1}) = \delta \mathbf{R}(\text{O1}) = 0$ ), то метод RMTA дает  $\delta V(\mathbf{r}) = 0$  в плоскости Cu1-O1 при любом разумном значении радиуса МТ-сферы иона бария (типичное значение  $R_{\text{МТ}}(\text{Ba})$ , используемое в расчетах зонной структуры по методу ЛППВ, составляет 2.9 а.е. [6], что существенно меньше расстояния между плоскостями Cu1-O1 и Ba-O4 — примерно 4 а.е.). Что касается плоскостей Cu2-O2-O3 и Ba-O4, то здесь изолинии потенциала возмущения в RMTA-модели представляли бы собой просто набор окружностей с центрами в точках, соответствующих узлам Cu2, O2, O3 и Ba, O4.

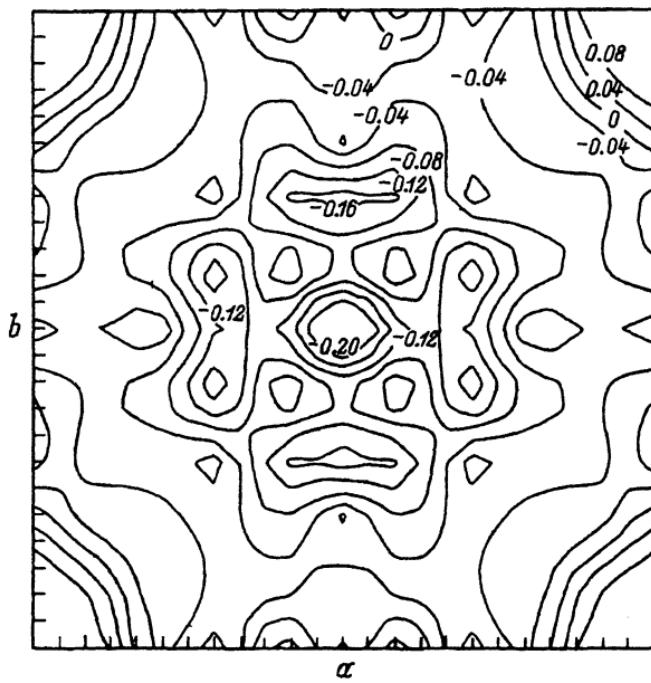


Рис. 4. Потенциал возмущения в плоскости Cu<sub>1</sub>-O<sub>1</sub>.  
Интервал между изолиниями — 0.04 Ry.

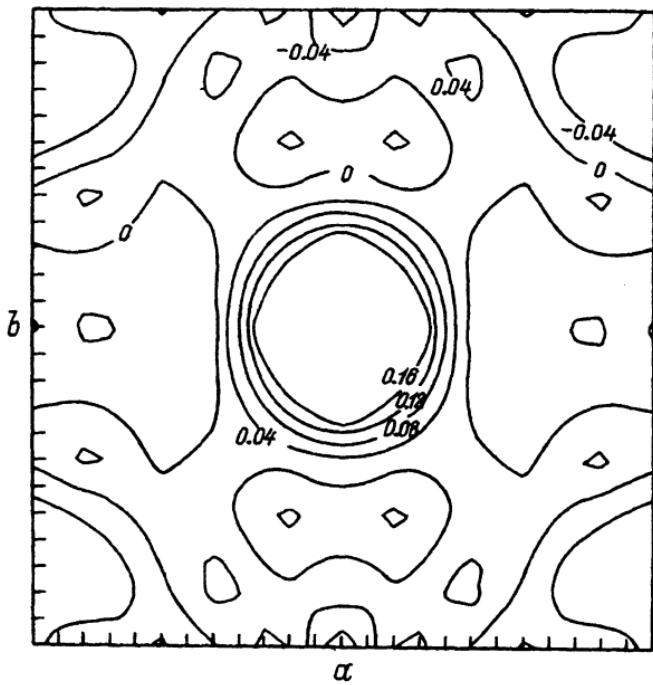


Рис. 5. Потенциал возмущения в плоскости Cu<sub>2</sub>-O<sub>2</sub>-O<sub>3</sub>,  $\Delta E = 0.04$  Ry.

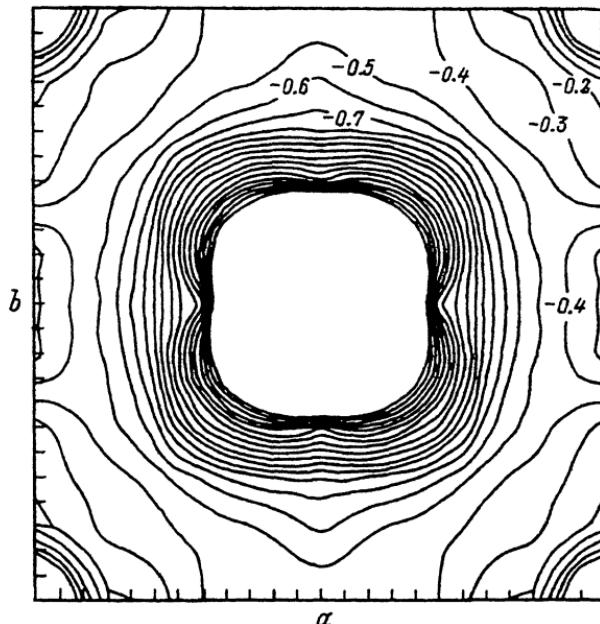


Рис. 6. Потенциал возмущения в плоскости, проходящей через узлы ·O4,  $\Delta E = 0.1 \text{ Ry}$ .

Используемый нами подход не требует в отличие от метода вмороженного в решетку фона (ab initio frozen phonon method) перерасчета зонной структуры для искаженной конфигурации кристаллической решетки [7]. Это существенно упрощает расчет матричных элементов электрон-фононного взаимодействия и особенно важно для ВТСП-соединений, характеризующихся сложной кристаллической структурой. Снятие ряда ограничений, накладываемых на потенциал возмущения МТ-аппроксимацией потенциала, может привести к существенным изменениям в расчетных значениях как параметра электро-фононного взаимодействия, так и температуры перехода в сверхпроводящее состояние.

#### Список литературы

- [1] Gaspari G.D., Gyorfy B.L. Phys. Rev. Lett. **28**, 13, 801 (1972).
- [2] Andersen O.K. Phys. Rev. **B12**, 12, 3060 (1975).
- [3] Skriver H.L. The LMTO method. Berlin, Heidelberg (1984). P. 281.
- [4] Гололобов Е.М., Дорожкин Н.Н., Новыш Б.В. ФТТ **35**, 9, 2371 (1993).
- [5] Слэтер Дж. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел. М. (1978). 661 с.
- [6] Schwarz K., Ambrosch-Draxl C., Blaha P. Phys. Rev. **B42**, 4, 2051 (1990).
- [7] Rodriguez C.O., Liechtenstein A.I., Mazin I.I., Jepsen O., Andersen O.K., Methfessel M. Phys. Rev. **B42**, 4, 2692 (1990).